

★ディペンダブルコンピューティング研究会 (DC)

専門委員長 梶原誠司 副委員長 金川信康

幹事 中村友洋・土屋達弘

日時 2月10日(月) 9:00~17:30

会場 機械振興会館地下3階2号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm TEL {03} 3434-8211)

議題 VLSI 設計とテスト及び一般

テスト容易化設計

1. モジュール間結合増加率に基づくスキランチェーン接続法 ○小松 巡・岩田大志・山口賢一(奈良高専)
2. TDC 組込み型バウンダリスキャン回路による遅延検出能力評価 ○櫻井浩希・四柳浩之・橋爪正樹(徳島大)
3. 非同期式 QDI 回路における任意の故障に対する検出手法 ○水谷早苗・岩田大志・山口賢一(奈良高専)

低消費電力テスト

4. DCSTP 回路に対する最適電力テストパターン順序付け手法 ○小河 亮・岩田大志・山口賢一(奈良高専)
5. SAT を用いた低キャプチャ電力指向ドントケア割当て法
○高橋慶安・山崎紘史・細川利典(日大)・吉村正義(九大)

テスト品質

6. 異なる欠陥粒径とピアオープンを考慮した重み付き故障カバレッジに関する一考察
○中山裕太(首都大東京)・新井雅之(日大)・史 虹波・岩崎一彦(首都大東京)
7. Fmax 結果を用いた大域ばらつき推定手法 ○新谷道広・佐藤高史(京大)
8. メルセンヌ・ツイスタアルゴリズムにもとづいた効果的なテストパターン生成器の提案
○里中沙矢香・岩田大志・山口賢一(奈良高専)

午後 特別講演(14:15~)

9. [特別講演] 岩崎一彦(首都大東京)

テストデータ圧縮

10. BAST におけるシフトデータ量削減法
○田中まりか・山崎紘史・細川利典(日大)・吉村正義(九大)・新井雅之(日大)
11. BAST におけるスキランシフト制御及び反転信号の部分リセットによるテストデータ量削減法
○森 凌太・四柳浩之・橋爪正樹(徳島大)
12. 制御ポイント挿入とドントケア抽出による遷移故障テストパターン数の削減法
○山崎紘史・高橋明彦・細川利典(日大)・吉村正義(九大)

ディペンダビリティとセキュリティ

13. Dual-FPGA アーキテクチャに基づく相互再構成型耐故障システムの実装
○森 拓馬・大元将一・岩垣 剛・市原英行・井上智生(広島市大)
14. XMesh プロトコルを用いたワイヤレスセンサーネットワークに対するワームホール攻撃の検出
○蓑原 隆・吉井 碧(拓殖大)

☆DC 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

3月15日(土), 16日(日) ICT文化ホール[締切済] テーマ:組込み技術とネットワークに関するワークショップ ETNET2014

4月25日(金) NII[2月14日(金)] テーマ:ディペンダブルコンピューティングシステム及び一般

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

土屋達弘(阪大大学院情報科学研究科)

E-mail: t-tutiya@ist.osaka-u.ac.jp

○最新情報は, DC 研究会ホームページを御覧下さい.

<http://www.ieice.org/iss/dc/jpn/index.html>